

从上往下测量

FISCHERSCOPE X-RAY XDV-SDD型仪器配备了感应区域大而分辨率良好的硅漂移接收器，这样在使用大准直器的情况下，可以达到很高的计数率，从而实现良好的重复精度和极低的检测下限。XDV-SDD极其适合痕量分析中超薄镀层的测量。由于提高了低能辐射的灵敏度，同时可测元素的范围也扩大到更低原子序数的元素，这样就可以可靠测量空气中的磷或铝。

为了使每次测量都能在最佳激励条件下进行，XDV-SDD配备了可切换的准直器和基本滤片。

XDV-SDD测量空间宽大，样品放置便捷，可以放置平整的样品，也可以放置形状复杂的大样品。连续测试或镀层厚度和元素分布的测量都可以方便地用快速可编程XY-工作台完成。

操作很人性化，测量门开启方便，仪器前部控制面板具备多种功能，日常使用轻松便捷。



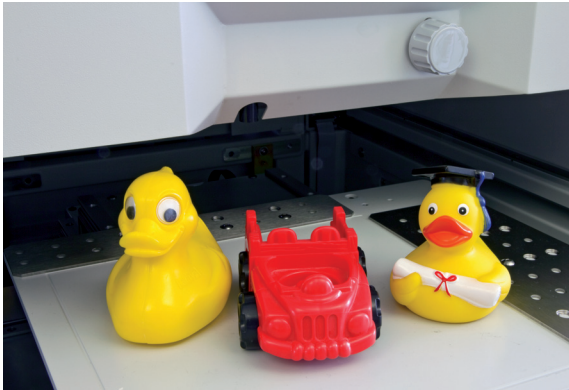
金属中的有害物质，例如：铝合金中的Pb、Cd

玩具：检测其中的Pb、Cd、Hg



测量位置的精确设定可以很方便地通过高分辨率和高放大倍数的摄像头完成，摄像头可以在操作时精确显示测量位置。激光点作为辅助定位装置进一步方便了样品的快速定位。

良好的性能和通用的设计使得XDV-SDD是研发、过程控制和实验室的理想选择。同时基于其健壮设计和用户友好，它也是品质保证和生产监控必不可少的设备。



应用实例

法律条例严格限制多种有害物质的含量，例如电子元件，玩具或包装材料。**XDV-SDD**使得快速方便地检测是否符合这些限制成为可能。例如，测量检出限仅仅几个ppm的特别重要的化学元素Pb、Hg和Cd等。

特征

- 带有铍窗口和钨钼的微聚焦X射线管。最高工作条件： 50 kV, 50W
- X射线探测器采用珀尔帖致冷的硅漂移探测器
- 准直器： 4个，可自动切换，从直径0.1mm到3mm
- 基本滤片： 6个，可自动切换
- 带弹出功能的可编程XY平台
- 视频摄像头可用来实时查看测量位置，十字线上有经过校准的刻度标尺，而测量点实际大小也在图像中显示。
- 设计获得许可，防护全面，符合德国X射线条例第4章第3节

典型应用领域

- 测量超薄镀层，例如电子和半导体行业
- 痕量分析，例如按照RoHS，玩具和包材指令检测有害物质
- 高精度黄金和贵金属分析
- 光伏行业
- 测量NiP层的厚度和成分



NiP/Fe: P含量分析以及镀层厚度测量

NiP/Fe: P含量分析以及镀层厚度测量